

第17回 NEDIA アクションセミナー開催のご案内

NEDIA では、アクションセミナー委員会で、会員様向けに、タイムリー、かつ役立つ業界情報を提供し、会員様の価値向上を図るべく、革新的なアクションセミナーを企画し開催をしています。

第17回は、先端技術が使われるカーエレクトロニクス分野において重要となっている信頼性評価について、この分野における知見の深い講師を迎え、開催することにしました。

ぜひ多くの会員様にご参加頂けることを心よりお待ちしております。

————— 開催案内 —————

1. 開催日時：2018年2月22日(金) 17:00～18:30
2. 開催場所：UTグループ株式会社 セミナールーム
住所：東京都品川区東五反田1丁目11番15号 電波ビル4F
マップ <http://www.ut-h.co.jp/corporate/map.html>
3. テーマ：「**車載電子デバイス・電子機器に求められる信頼性評価について ～ECU搭載電子部品の選定に有効なLSIプロセス診断&ISOなど諸規格に対応した環境試験の全貌～**」
<講演概要>
エレクトロニクスの応用分野はますます多岐にわたり拡大しています。特にカーエレクトロニクス分野においてはパワートレーン制御や快適デバイスに加え、車両間通信による安全運転支援などエレクトロニクスの先端技術が用いられており、部品レベルはもとよりシステムとしての信頼性評価が重要になっています。
OKIグループのOKIエンジニアリング（以下、OEG）は車載電子デバイス・電子機器に関わる企画、設計、試作評価、認定試験、量産製造等の全プロセスにおいて、それぞれ必要となる設計・開発支援、信頼性評価・解析及び各種試験サービスをワンストップで提供しています。
今回は、解析が難しい先端技術のLSI工程課題の抽出に有効とされる、部品の状態や欠陥の観察から、将来故障に至る危険性を推定する〔良品解析〕のLSIプロセス診断を解説します。
車載電子デバイスから電子機器の諸環境に対する耐性を確認する規格対応の環境試験について、どのようなものがあるか解説し、さらに自動車メーカー規格要求が多くなっている特殊環境試験、さらには環境試験後の評価（ウイスカ観察やコネクタ評価）までも含めてご説明いたします。
4. 講師：沖エンジニアリング株式会社 信頼性解析事業部事業部長 中村 隆治 氏
システム評価事業部事業部長 中嶋 龍一 氏
5. タイムテーブル：16:30～受付開始
17:00～18:00 セミナー
18:00～質疑応答（終了は18:30予定）
6. 参加費：NEDIA 会員 1,000円、非会員 3,000円
ご参加の申込みは、2月16日(金)までにメールにて事務局までお願い致します。
申込みを確認後、事務局より返信いたします。
定員(約40名程度)になりましたら、申込みの受け付けを終了させていただきます。
<事務局連絡先>

E-mail：info@nedia.or.jp TEL：03-5823-4465 FAX：03-5823-4475